

19



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

11

Veröffentlichungsnummer:

0 349 911
A2

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21

Anmeldenummer: 89111893.7

81

Int. Cl.4: H01J 37/20 , G01N 27/00 ,
B25J 7/00

22

Anmeldetag: 30.06.89

30

Priorität: 03.07.88 DE 3822504

43

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
10.01.90 Patentblatt 90/02

84

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

71

Anmelder: Kernforschungsanlage Jülich
GmbH
Wilhelm-Johnen-Strasse
D-5170 Jülich(DE)

72

Erfinder: Besocke, Karl-Heinz
Tuchbleiche 8
D-5170 Jülich(DE)
Erfinder: Teske, Martin
Am hinzenbusch 42
D-5160 Düren(DE)
Erfinder: Frohn, Josef
Rubensstrasse 15
D-5102 Herzogenrath(DE)
Erfinder: Wolf, J. Francis
Artilleriestrasse 45
D-5170 Jülich(DE)

54

Mikromanipulator.

57 Zur Mikrobewegung eines Objekts relativ zu einer vorgegebenen Bearbeitungs- oder Analyseposition wird ein Mikromanipulator angegeben, der beispielsweise zur Ausführung von Objektbewegungen bei Raster-Tunnel-Mikroskopen (RTM) einsetzbar ist. Der Mikromanipulator weist mehrere Bewegungselemente (2, 2', 2'') auf, die das Objekt (1) zugleich stützen und bewegen. Zur Ausführung von Mikrobewegungen sind die Bewegungselemente piezoelektrisch verstellbar, die Auflagen (3, 3', 3'') lassen sich durch Verformen piezoelektrischen Materials verschieben. Um mit dem Mikromanipulator auch Makrobewegungen ausführen zu können sind mit zumindest einem der Bewegungselement (2) auch Makrobewegungen durchführbar. Geeignet ist hierzu die Auflage (3) des Bewegungselementes (2) selbst. Die Auflage (3) läßt sich in einer piezoelektrisch verformbaren Büchse (7) einsetzen. Makrobeweglich kann aber auch ein Teilstück (14) der Basisplatte (5a) ausgebildet sein, auf der die Bewegungselemente (2a, 2a', 2'') befestigt sind.

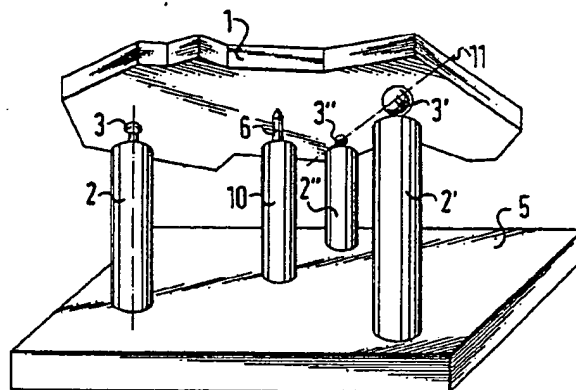


FIG. 1

EP 0 349 911 A2

Mikromanipulator

Die Erfindung bezieht sich auf einen Mikromanipulator zur Bewegung eines Objekts relativ zu einer Bearbeitungs- oder Analyseposition so, daß zumindest ein Teil der Objektoberfläche bearbeitet oder analysiert werden kann. Der Mikromanipulator weist mehrere Bewegungselemente auf, die das Objekt oder einen Objekthalter abstützen und die hierzu mit einer Auflage für das Objekt oder den Objekthalter versehen sind. Zur Ausführung von Mikrobewegungen sind die Bewegungselemente piezoelektrisch verstellbar.

Mikromanipulatoren dieser Art sind zur Ausführung von Bewegungen bei Raster-Tunnel-Mikroskopen (RTM) bekannt. Das RTM erfordert ein Höchstmaß an Präzision für die Bewegung des jeweils zu untersuchenden Objekts relativ zur Abtastnadel (Tunnelspitze) des RTM's.

In DE-OS-36 10 540 wird ein Mikromanipulator beschrieben, bei dem zur Abstützung des zu untersuchenden Objekts mehrere Bewegungselemente aus piezoelektrischem Material benutzt werden. Die Bewegungselemente sind derart ausgebildet, daß durch Mikrobewegungen sowohl Translations- als auch Rotationsbewegungen sowie ein Kippen des Objekts möglich ist. Der beschriebene Mikromanipulator ist auf Mikrobewegungen des Objekts eingerichtet, wobei in der zu bearbeitenden Addition von Mikrobewegungen auch Makrobewegungen möglich sind. Senkrecht zur vorgenannten Objektebene sind Bewegungen nur insoweit ausführbar, als es die durch Anlegen elektrischer Spannungen erreichbare Verformung des piezoelektrischen Materials zuläßt.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Mikromanipulator zu schaffen, mit dem sich in jeder Richtung mit den für die Mikrobewegung vorgesehenen Bewegungselementen zugleich auch Makrobewegungen ausführen lassen.

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung bei einem Mikromanipulator der eingangs genannten Art gemäß Patentanspruch 1 dadurch gelöst, daß das Objekt zumindest auf einem der Bewegungselemente derart gelagert ist, daß auch senkrecht zur Bearbeitungs- oder Analyse-Ebene des Objekts zugleich Mikro- und Makrobewegungen ausführbar sind. Dies ermöglicht eine Anpassung des Abstandes zwischen Bearbeitungs- und Analyse-Ebene und Bearbeitungswerkzeug, beispielsweise die Einstellung des Abstandes zwischen zu bearbeitender oder zu analysierender Objektoberfläche und Abtastnadel eines RTM's, auch bei einer rauen Objektoberfläche, deren Rauigkeit durch Mikrobewegungen allein durch Verformen des piezoelektrischen Materials nicht ausgleichbar sind, oder nach Auswechseln und Montage der Abtastnadel.

Zur Makrobewegung ist insbesondere die Auflage eines Bewegungselementes geeignet, Patentanspruch 2. Die Auflage wird nach Patentanspruch 3 bevorzugt im Bewegungselement selbst bewegbar gelagert, wobei zugleich eine Führung der Auflage am Bewegungselement vorgesehen ist. Zweckmäßig ist es, die Auflage in einer im Bewegungselement befestigten, axial verlaufenden Buchse so zu lagern, daß Reibkräfte zwischen einander angrenzenden Oberflächen von Auflage und Buchse eine Bewegung der Auflage in der Buchse verhindern. Die Reibkräfte müssen so bemessen sein, daß sie einerseits zur Stütze des Objekts ausreichend sind und daß andererseits durch Anlegen von Spannungsfunktionen an das piezoelektrische Bewegungselement ein Gleiten der Auflage in der Buchse in axialer Richtung erreichbar ist, Patentanspruch 4. In dieser Ausführungsform der Erfindung ist die piezokeramische Ausbildung des Bewegungselementes auch senkrecht zur Bearbeitungs- oder Analyse-Ebene sowohl für die Mikrobewegung als auch die Makrobewegung des Objekts ausnutzbar.

Eine rein mechanische Variante der Erfindung ist in Patentansprüchen 5 bis 7 angegeben. Zumindest eines der Bewegungselemente des Mikromanipulators ist auf einem Teilstück der Basisplatte befestigt, das makrobeweglich ist. Gemäß der Erfindung ist das Teilstück gegen die Kraft einer Feder verstellbar, die einerseits an der Basisplatte, andererseits am Teilstück befestigt ist. Zum Verstellen des Teilstückes sind zwei Blattfedern aufeinanderliegend angeordnet, die gegeneinander spreizbar sind. Beim Spreizen der Blattfedern ändert sich der Abstand zwischen den Befestigungsstellen der Blattfedern an Basisplatte und Teilstück, so daß bei ortsfester Basisplatte das Teilstück bewegt wird. Wesentlich ist, daß sich durch das Spreizen der Blattfedern eine parabolische Abhängigkeit zwischen Spreizweg und Verstellung des Teilstückes ergibt, die Verstellbarkeit nimmt mit stärker werdender Spreizung der Blattfedern zu. Die Blattfedern sind deshalb am Teilstück so angeordnet, daß die Einstellempfindlichkeit zwischen Objekt und beispielsweise einer Abtastnadel eines RTM's mit fortschreitender Annäherung von Objekt und Abtastnadel erhöht wird.

Eine Variante der Erfindung, bei der für die Makrobewegung ebenfalls die piezoelektrische Steuerung der Bewegungselemente genutzt wird, betreffen die Patentansprüche 8 bis 10. Danach stützen die Bewegungselemente das Objekt oder den Objekthalter über eine zur Stützrichtung der Bewegungselemente schief verlaufende Stützebene ab, deren Normale einen Winkel zur Stützrichtung

der Bewegungselemente aufweist. Wird die schiefe Stützebene durch Bewegung der piezoelektrischen Bewegungselemente verschoben, so ändert sich die Lage der mit der schiefen Ebene fest verbundenen Objektoberfläche in Stützrichtung der Bewegungselemente. Die zu wählende Größe des Winkels ist einerseits abhängig von der Leistungsfähigkeit der piezoelektrischen Bewegungselemente hinsichtlich ihrer seitlichen Auslenkbarkeit am Auflagepunkt, andererseits von den Reibungskräften, die an den Auflagepunkten der Bewegungselemente auf der Oberfläche der Stützebene herrschen. Um die Reibungskräfte gering zu halten wird die Stützebene bevorzugt poliert. Eine Bewegung der Stützebene mittels der Bewegungselemente oder eine Bewegung des Mikromanipulators bei ortsfestem Objekt erfolgt durch Anlegen elektrischer Spannungsverläufe an der Piezokeramik der Bewegungselemente. Die Wahl des Winkel bestimmt das Maß der Verschiebung der zu bearbeitenden oder zu analysierenden Objektoberfläche senkrecht zur Bearbeitungs- oder Analyse-Ebene, also beispielsweise senkrecht zur Abtastnadel des RTM's.

Bevorzugt ist die schiefe Stützebene schraubenförmig ausgebildet und wird von den Bewegungselementen in axialer Richtung abgestützt, so daß sich beim Rotieren der Stützebene die Bearbeitungs- oder Analyseebene axial verschiebt. Vorteilhaft ist es, die schraubenförmig verlaufende Stützebene in mehrere gleichartig gestaltete Abschnitte aufzuteilen, wobei jeder Abschnitt von einem der Bewegungselemente abgestützt wird.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Die Zeichnung zeigt im einzelnen:

Figur 1 Mikromanipulator mit einem Bewegungselement mit verstellbarer Auflage;

Figur 1a Längsschnitt eines Bewegungselementes mit verstellbarer Auflage, Ausschnitt;

Figur 1b Querschnitt eines Bewegungselementes nach Figur 1a gemäß Schnittlinie b/b;

Figur 2 Mikromanipulator mit einem mechanisch bewegbaren Bewegungselement;

Figur 3 Mikromanipulator nach Figur 2 mit einem mittels Blattfedern befestigtem Teilstück der Basisplatte;

Figur 4 Mikromanipulator mit schiefer Stützebene;

Figur 5 schraubenförmig verlaufende Stützebene eines Mikromanipulators;

Figur 6 Mikromanipulator mit Stützebene mit schraubenförmig verlaufenden Abschnitten.

Figur 1 der Zeichnung zeigt einen Mikromanipulator zur Bewegung eines Objekts oder Objekthalter 1 mittels drei den Objekthalter stützenden Bewegungselementen 2, 2', 2". Der Objekthalter liegt auf Auflagen 3, 3', 3" der Bewegungselemente

in stabiler Lage auf. Die im Ausführungsbeispiel zylindrischen Bewegungselemente 2, 2', 2" sind mit senkrecht verlaufender Zylinderachse 4 auf einer Basisplatte 5 befestigt. Der Mikromanipulator dient zur Bewegung des Objekts relativ zu einer Abtastnadel 6, die im Ausführungsbeispiel zwischen den Bewegungselementen 2, 2', 2" auf einem Bewegungselement 10 angeordnet und ebenfalls auf der Basisplatte 5 befestigt ist.

Im Ausführungsbeispiel handelt es sich um einen Mikromanipulator für ein RTM, wobei das Objekt 1 zur Abtastnadel 6 des RTM's im Nanobereich verschiebbar ist. Die Anordnung der Abtastnadel 6 auf dem Bewegungselement 10 auf der Basisplatte 5 zwischen den Bewegungselementen 2, 2', 2" ist nicht zwingend. Die Abtastnadel mit dem Bewegungselement 10 läßt sich auch an anderer Stelle auf der Basisplatte befestigen. Wegen der nicht unbeachtlichen Temperaturdrift zwischen den Bewegungselementen 2, 2', 2" und der Abtastnadel 6 bei einer Bearbeitung oder Analyse der Objektoberfläche mittels RTM ist jedoch die Anordnung von Bewegungselementen und Abtastnadel auf der gleichen Basisplatte von großem Vorteil.

Im Ausführungsbeispiel nach Figur 1 sind die Auflagen 3, 3" starr mit den zugehörigen Bewegungselementen 2', 2" verbunden. Die Auflage 3 des Bewegungselementes 2 ist dagegen beweglich angeordnet. Wie in Figur 1a gezeigt ist, ist die Auflage 3 in einer Buchse 7 innerhalb des Bewegungselementes 2, dessen piezoelektrisches Material 8 als Rohr ausgebildet ist, axial verlaufend eingesetzt. Im Ausführungsbeispiel ist die Buchse 7 in das piezoelektrische Material 8 eingebettet. Durch Anlegen von elektrischen Spannungsverläufen an das piezoelektrische Material über elektrische Leiter 9, läßt sich die Buchse durch Verformen des Materials gegenüber die Auflage verschleben. Dabei unterstützen Rammeffekte die Bewegung, insbesondere läßt sich die Auflage durch Stöße gegen Objekt oder Objekthalter versetzen. Die elektrischen Leiter 9 werden von einem Generator gespeist, der zur Erzeugung der gewünschten Steuerspannungen für die erforderlichen Verformungen des piezoelektrischen Materials dient. Der vorgenannte Generator ist in der Zeichnung nicht dargestellt.

Die Buchse 7 und die Auflage 3 sind so dimensioniert, daß zwischen ihren aneinandergrenzenden Oberflächen Reibkräfte herrschen, die die Auflage 3 bei aufgelegtem Objekt bzw. Objekthalter 1 in der Buchse 7 unverschieblich festhalten. Zum Verschleben der Auflage 3 werden am piezoelektrischen Material 8 solche Steuerspannungsimpulse angelegt, daß sich das piezoelektrische Material spontan axial streckt oder verkürzt und dabei die Haftreibungskräfte zwischen Buchse 7 und Auflage 3 überwindet, so daß sich die Auflage infolge ihrer

Massenträgheit innerhalb des Bewegungselementes relativ zur Buchse verschiebt. Es lassen sich auf diese Weise sowohl Aufwärts- wie Abwärtsbewegungen der Auflage im Bewegungselement durchführen.

Bei einer Bewegung der Auflage 3 innerhalb des Bewegungselementes 2 verändert sich die Lage des Objekts 1 relativ zur Abtastnadel 6. Im Ausführungsbeispiel wird das Objekt 1 um eine Achse 11 gekippt, Figur 1, deren Lage von den ortsunverändert bleibenden Auflagen 3', 3'' der Bewegungselemente 2', 2'' vorgegeben ist. Mit dem Kippen des Objekts 1 um die Achse 11 wird eine Bewegung zwischen Abtastnadel und zu bearbeitender oder zu analysierender Objektoberfläche auch im Makrobereich erzeugt.

Soll statt der Kippbewegung eine parallele Bewegung des Objekts erreicht werden, ist es selbstverständlich möglich, alle Bewegungselemente 2, 2', 2'' mit einer beweglichen Auflage 3 auszurüsten. Das Objekt oder der Objekthalter lassen sich dann durch Anlegen entsprechender Spannungsimpulse gleichmäßig bewegen.

Für die Mikrobewegung des Objekts sind die Bewegungselemente 2, 2', 2'' im Ausführungsbeispiel sämtlich hohlzylindrisch ausgebildet, wie dies in Figur 1a für das Bewegungselement 2, im Längsschnitt gezeigt ist. In Figur 1b ist ein Querschnitt des Bewegungselementes gemäß Schnittlinie b/b nach Figur 1a senkrecht zur Zylinderachse 4 wiedergegeben. Aus den Figuren ist ersichtlich, daß das piezoelektrische Material 8 auf seiner Innenseite mit einer Innenelektrode 12, auf seiner äußeren Seite mit Streifenelektroden 13, 13', 13'' bedeckt ist, die in Richtung der Zylinderachse 4 verlaufen. Werden an den Elektroden Spannungsverläufe angelegt, so lassen sich die Bewegungselemente in ihrer Länge verändern oder biegen. Gemäß der Erfindung bedarf es also nur der Regelung dieser Spannungsverläufe, um Objekt oder Objekthalter in jede Richtung zu bewegen, wobei Makrobewegungen durch schrittweise Addition von Mikrobewegungen auch senkrecht zur Bearbeitungs- oder Analyse-Ebene des Objekts erreicht werden.

Im Ausführungsbeispiel nach Figur 1a sind die für die senkrechte Bewegung des Objekts erforderlichen Elemente, nämlich bewegliche Auflage 3 und im piezoelektrischen Material 8 eingebettete Buchse 7, im Bewegungselement integriert. Diese Elemente können jedoch auch separat angeordnet und mit dem Bewegungselement verbunden sein.

In Figur 2 ist ein Mikromanipulator wiedergegeben, bei dem eines der Bewegungselemente 2a, 2a', 2a'', im Ausführungsbeispiel das Bewegungselement 2a, auf einem relativ zur Basisplatte 5a beweglichen Teilstück 14 angeordnet ist. Bei Bewegung des Teilstückes 14, im Ausführungsbeispiel

spiel ist eine Bewegung des Teilstückes senkrecht zur Oberfläche der Basisplatte 5a vorgesehen, wird der Objekthalter 1a des Mikromanipulators nach Figur 2 - analog zum Objekt 1 nach Figur 1 - um eine durch die Stützpunkte der Bewegungselemente 2a', 2a'' am Objekthalter 1a verlaufende Achse 11a gekippt.

Zur Mikrobewegung des Objekts sind die Bewegungselemente 2a, 2a', 2a'' in gleicher Weise wie Bewegungselemente 2, 2', 2'' nach Figur 1, 1a und 1b ausgebildet.

Ein zwischen Blattfedern an der Basisplatte 5a befestigtes Teilstück 14a zeigt Figur 3. Es ist an einem seiner Enden mit einer Blattfeder 15 an der Basisplatte 5a befestigt, mit dem anderen Ende über zwei Blattfedern 16, 17, die im entspannten Zustand aufeinanderliegend angeordnet sind, mit der Basisplatte 5a verbunden. Die Blattfedern 16, 17 lassen sich mittels einer Spannschraube 18 spreizen. Dabei nimmt der Verstellweg des Teilstückes 14 in Abhängigkeit vom Spreizabstand 19 zwischen den Blattfedern 16, 17 mit zunehmender Spreizung parabolisch zu. Die Blattfedern 16, 17 sind zwischen Basisplatte 5a und Teilstück 14 derart angeordnet, daß sich bei fortschreitender Annäherung von Objekt und Abtastnadel die Einstellempfindlichkeit des Teilstückes 14 beim Verstellen der Spannschraube 18 erhöht. Die Blattfedern 16, 17 sind hierzu im Ausführungsbeispiel nach Figur 3 parallel zur Verstellrichtung 20 des Teilstückes 14 zwischen Basisplatte und Teilstück angeordnet. Beim Spreizen der Blattfedern wird das Teilstück 14 gegen die Kraft der Blattfeder 15 angehoben, so daß sich Objekthalter und Objekt von der Abtastnadel abheben. Beim Absenken des Objekts durch Entspannen der Blattfedern 16, 17 nimmt die Einstellempfindlichkeit beim Verstellen der Spannschraube 18 mit geringer werdendem Abstand zwischen Objektoberfläche und Nadelspitze der Abtastnadel zu.

Das Untersetzungsverhältnis zwischen durch Spreizen der Blattfedern 16, 17 erzeugtem Verstellweg des Teilstückes und Abstand zwischen Objektoberfläche und Abtastnadel wird durch Wahl der Hebelverhältnisse $L_1 : L_2, L_3 : L_4$ sowie durch die Steigung des Schraubengewindes der Spannschraube 18 in weiten Grenzen variabel.

Einen Mikromanipulator, dessen Bewegungselemente 2b, 2b', 2b'' eine schiefe Stützebene 21 abstützen, zeigt Figur 4. Die Stützebene 21 ist Teil des Objekthalters 1b, mit dem das zu bearbeitende oder zu untersuchende Objekt 1b' fest verbunden ist. Auch der in Figur 4 wiedergegebene Mikromanipulator dient zur Bewegung eines Objekthalters eines RTM's, dessen Abtastnadel 6b mit ihrem Bewegungselement 10b gemeinsam mit den Bewegungselementen 2b, 2b', 2b'' auf ein und derselben Basisplatte 5b angeordnet ist.

Die im Ausführungsbeispiel nach Figur 4 ebenfalls zylindrisch ausgebildeten Bewegungselemente 2b, 2b', 2b'' stehen auf der Basisplatte 5b senkrecht, ihre Zylinderachsen 4b sind parallel zur Stützrichtung 22 der Bewegungselemente angeordnet. Stützrichtung 22 und Normale 23 der Stützebene 21 verlaufen winklig zueinander. Der zwischen der Stützrichtung 22 und der Normalen 23 gebildete Winkel ist so gewählt, daß auch bei Bewegung des Objekträgers 1b mittels der piezoelektrisch erregbaren Bewegungselemente eine ausreichende Haftung zwischen den Auflagen 3b, 3b', 3b'' der Bewegungselemente und der Oberfläche der schiefen Stützebene gegeben ist. Der Objekträger 1b darf auf den Bewegungselementen nicht rutschen. Darüber hinaus ist für die Wahl des Winkels die Leistungsfähigkeit der piezoelektrischen Bewegungselemente zur Bewegung des Objekträgers zu berücksichtigen. Mit steigender Leistungsfähigkeit läßt sich der Winkel vergrößern.

Bei Bewegung der Bewegungselemente läßt sich die schiefe Stützebene verschieben und damit der Abstand zwischen Objektoberfläche und Nadelspitze der Abtastnadel verändern. Der Abstand zwischen Nadelspitze und Objektoberfläche bleibt konstant, wenn die schiefe Ebene parallel zu einer waagerechten Kante verschoben wird, in Figur 4 ist eine solche Verschiebung bei einer Verschiebung des Objekträgers in Richtung der Pfeile 24 gegeben.

Figur 5 zeigt einen Objekthalter 1c mit schraubenförmig verlaufender Stützebene 25. Bei rotierender Bewegung der Stützebene 25 mittels in Figur 5 nicht dargestellter Bewegungselemente wird das im Objekthalter 1c zentral angeordnete Objekt 1c' in Richtung der Schraubenachse 26 bewegt.

Einen mit einer ebenfalls schraubenförmigen Stützebene ausgerüsteten Mikromanipulator zeigt Figur 6. Der Objekthalter 1d dieses Mikromanipulators weist eine Stützebene 27 auf, die aus mehreren, im Ausführungsbeispiel aus drei schraubenförmig verlaufenden Abschnitten 28, 28', 28'' besteht. Jeder der Abschnitte ist im Ausführungsbeispiel gleichartig ausgebildet, insbesondere weisen die Schraubenflächen jeweils eine gleiche Steigung auf, im Ausführungsbeispiel eine Steigung von 0,3 mm pro Abschnitt. Die Abschnitte 28, 28', 28'' werden jeweils von einem der Bewegungselemente 2d, 2d', 2d'' abgestützt. Im Ausführungsbeispiel ist der Objekthalter 1d ortsfest angeordnet und der Mikromanipulator auf der Stützebene frei beweglich. Der Mikromanipulator bewegt sich in Richtung einer Zentralachse 29, wenn die Bewegungselemente den Mikromanipulator über die Stützebene um die Zentralachse drehen. Im Objekthalter 1d ist das zu bearbeitende oder analysierende Objekt 1d' zentral angeordnet. Die Objektoberfläche verläuft

parallel zur Basisplatte 5d des Mikromanipulators, auf der in gleicher Weise wie in allen vorangegangenen Ausführungsbeispielen eine Abtastnadel 6d eines RTM's mit ihrem Bewegungselement 10d und den Bewegungselementen 2d, 2d', 2d'' befestigt ist. Bei Rotation des Mikromanipulators durch die Bewegungselemente wird der Abstand zwischen Objektoberfläche und Nadelspitze der Abtastnadel 6d verringert oder vergrößert.

Für die Einstellung des Abstandes zwischen zu bearbeitender oder zu analysierender Objektoberfläche sind in den Ausführungsbeispielen auch die Bewegungselemente 10 mit den Abtastnadeln piezoelektrisch beweglich.

Ansprüche

1. Mikromanipulator zur Bewegung eines Objekts relativ zu einer Bearbeitungs- oder Analyseposition zum Bearbeiten oder Analysieren von zumindest einem Teil der Objektoberfläche, mit mehreren das Objekt oder einen Objekthalter stützenden, zur Ausführung von Mikrobewegungen piezoelektrisch verstellbaren Bewegungselementen, die je eine Auflage für das Objekt oder den Objekthalter aufweisen,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Objekt auf zumindest einem der Bewegungselemente derart gelagert ist, daß neben den Mikrobewegungen relativ zur Bearbeitungs- oder Analyseposition auch Makrobewegungen ausführbar sind.

2. Mikromanipulator nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daß mit der Auflage (3) eines Bewegungselementes (2) Makrobewegungen ausführbar sind.

3. Mikromanipulator nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Auflage (3) vom Bewegungselement (2) geführt und am Bewegungselement (2) bewegbar angeordnet ist.

4. Mikromanipulator nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Auflage (3) in einer am Bewegungselement (2) befestigten Buchse (7) so gelagert ist, daß Reibkräfte zwischen einander angrenzenden Oberflächen von Auflage (3) und Buchse (7) eine Bewegung verhindern und zur Stütze des Objekts oder des Objekthalters (1) ausreichend sind, und daß durch Anlegen von Spannungsfunktionen an das piezoelektrische Bewegungselement (2) ein Gleiten der Auflage (3) in der Buchse (7) erreichbar ist.

5. Mikromanipulator nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Bewegungselement (2a) auf einem Teilstück (14) der Basisplatte (5a) montiert ist, das zur Ausführung von Makrobewegungen geeignet ist.

6. Mikromanipulator nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Teilstück (14) gegen die Kraft einer Feder
(15) verstellbar ist, die einerseits an der Basisplatte
(5a) andererseits am Teilstück (14) befestigt ist. 5

7. Mikromanipulator nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß zur Verstellung des Teilstücks (14) zwei im
entspannten Zustand aufeinanderliegend angeord-
nete Blattfedern (16, 17) eingesetzt sind, die ge- 10
geneinander spreizbar sind.

8. Mikromanipulator nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Bewegungselemente (2b, 2b', 2b'') das
Objekt oder den Objekthalter (1b) über eine Stütz- 15
ebene (21) abstützen, deren Normale einen Winkel
zur Stützrichtung (22) der Bewegungselemente (2b,
2b', 2b'') aufweist.

9. Mikromanipulator nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, 20
daß die schiefe Stützebene (27) schraubenförmig
verläuft und von den Bewegungselementen in axia-
ler Richtung abgestützt wird.

10. Mikromanipulator nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, 25
daß die schraubenförmig verlaufende Stützebene
(27) in mehrere gleichartig gestaltete Abschnitte
(28, 28', 28'') aufgeteilt ist, wobei jeder der Ab-
schnitte (28, 28', 28'') jeweils von zumindest einem
der Bewegungselemente (2a, 2a', 2a'') abgestützt 30
wird.

35

40

45

50

55

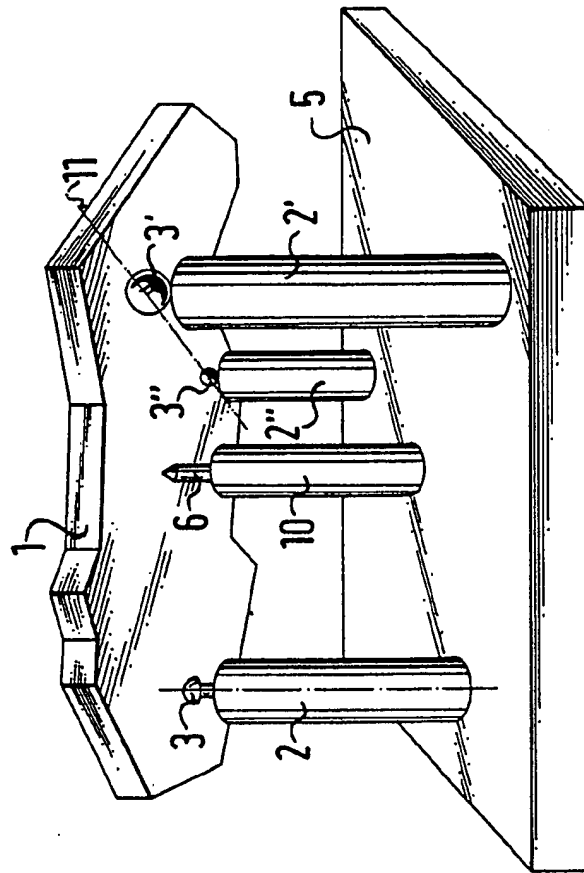


FIG. 1

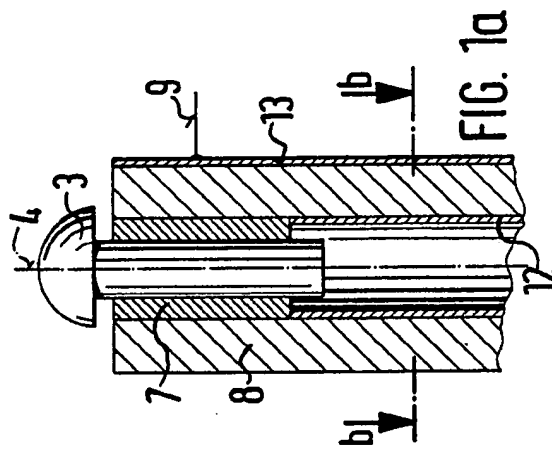


FIG. 1a

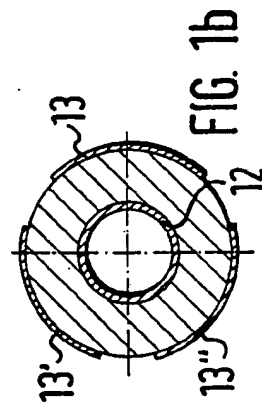
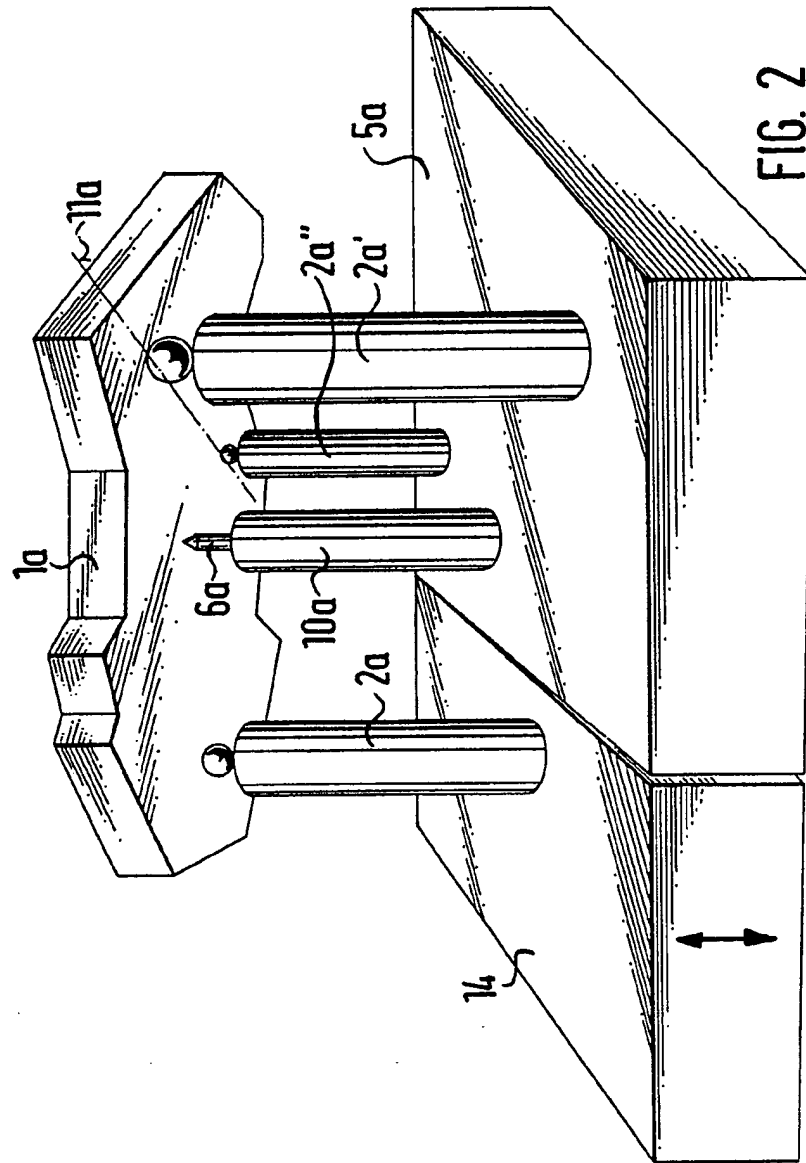


FIG. 1b



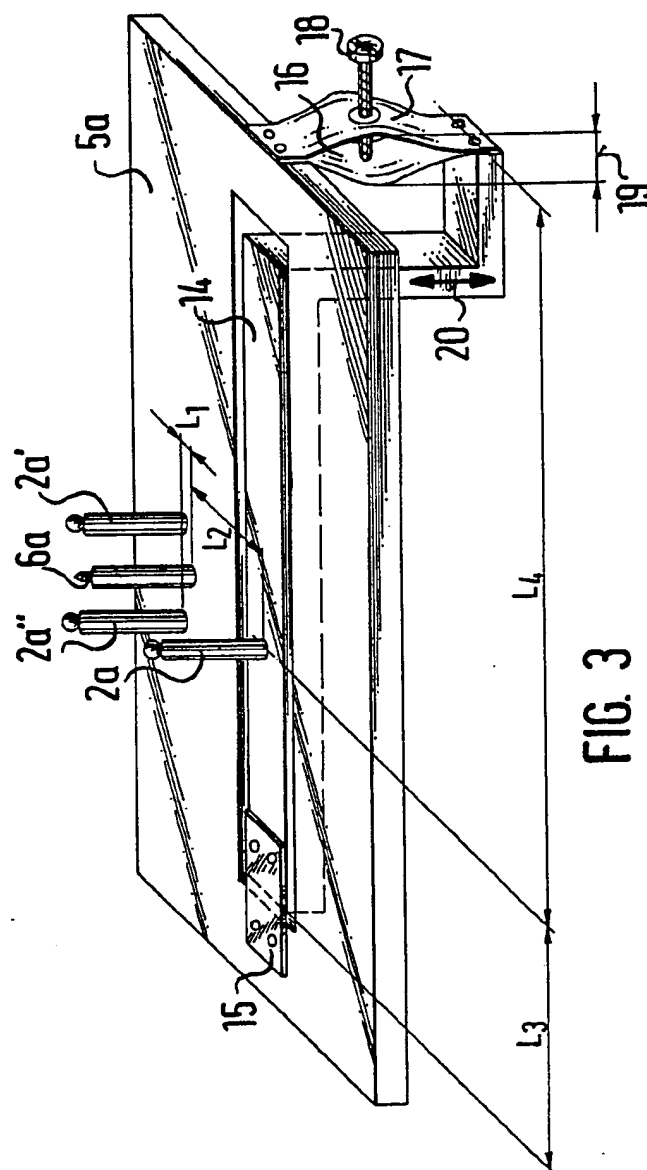


FIG. 3

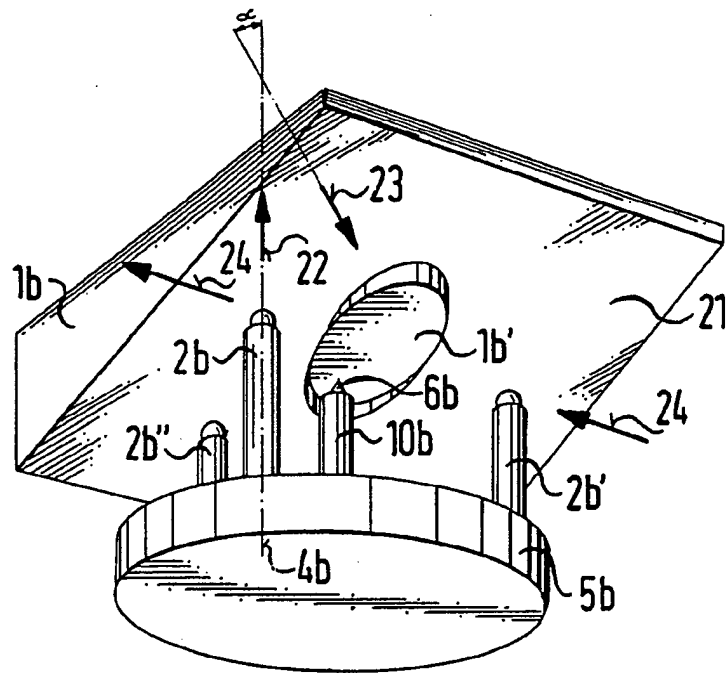


FIG. 4

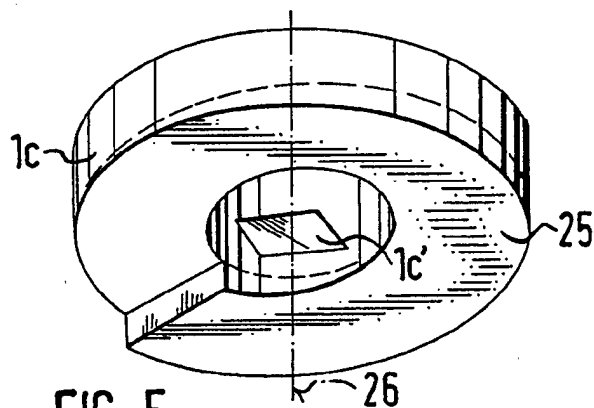


FIG. 5

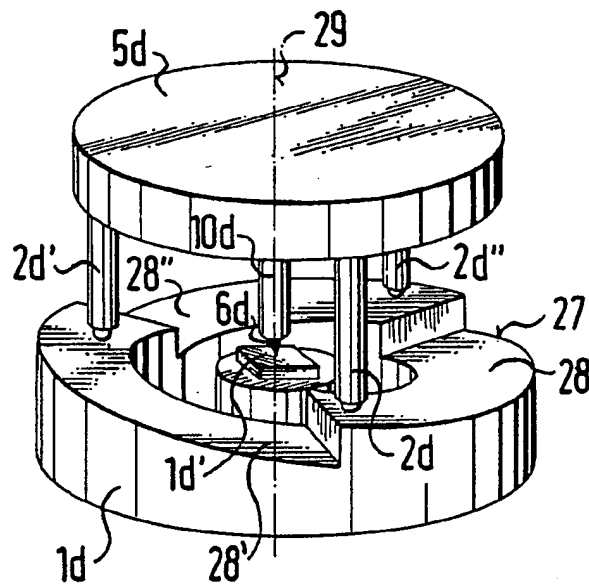


FIG. 6